

G01J 赤外線，可視光線または紫外線の強度，速度，スペクトル，偏光，位相またはパルスの測定；色の測定；放射温度測定 [2]

### 注

(1) このサブクラスは他に分類されない赤外線，可視光線，紫外線の有無の検出を包含する。  
(2) クラス G01 のタイトルに続く注に注意すること。

### サブクラス内の索引

測光；高温計..... 1/00;5/00  
分光測定；測定；偏光；速度；位相；パルス  
3/00;4/00;7/00;9/00;11/00

1/00 測光，例．写真の露出計（分光度測定 G01J3/00；放射温度測定に特に適合するもの G01J5/00）

A 検査に係るもの

B ・光センサ

C ・発光ダイオード

D ・光ファイバ

E ・配光

F ・光源；ランプ

G 視感測定に係るもの

H 測定法に係るもの

K 検波型光検出に係るもの

Z その他のもの〔バイオ光センサ含む〕

1/02 ・細部

A 光検出器

B ・半導体光検出器〔赤外線，波長弁別含む〕

C ・赤外線検出器

Y ・焦電型

W ・物体検知用

X ・リモセン用

D ・ストリク管等〔光電子増倍管含む〕

N 光導電型

P 投受型〔物体検知含む〕

Q アレイ型〔イメージセンサ含む〕

R 特殊型〔導波路型，熱電型，液晶，温度・光センサ含む〕

E 露出計

F 積分球

G 紫外線に係るもの〔検出器含む〕

H 赤外線に係るもの〔光学要素含む〕

J 火災・燃焼状態に係るもの

K レザ・光パワに係るもの

L 光ビームに係るもの〔ビーム径含む〕

M 光ファイバを用いるもの

S 照度計〔照度計付機器含む〕

T 輝度計

U 日射計〔太陽センサ含む〕

V 光度計

Z その他のもの〔振動，感電含む〕

1/04 ・光学部分または機械部分

A 光学要素

B ・フィルタ

C ・チヨツパ

D 光学走査・測光機構

E 汚れ防止装置

F 特殊用途

G ・光学読取

H ・欠陥検査

J ・液体分析

K ・気体分析

L ・固体分析

M ・生体分析

Z その他のもの

1/06 ・入射角の限定

A 視野限定

B 光軸調整

C 照準機構

Z その他のもの〔位置調整含む〕

1/08 ・特に測光に適用される光源の構成

1/10 ・参照光，または電気値との比較によるもの

1/12 ・全体的視覚手段によるもの（G01J1/20 が優先）

1/14 ・段階的輝度の表面との比較によるもの

1/16 ・電気的な放射線検出器によるもの（G01J1/20 が優先）

1/18 ・参照電気値との比較によるもの

1/20 ・測定値または参照値の強度が検出器における効果と等しくなるように変えられるもの，例．入射角の変化によるもの

1/22 ・光路中に可変素子を使用するもの，例．フィルタ，偏光手段（G01J1/34 が優先）

1/24 ・電気的な放射線検出器によるもの

1/26 ・測定値または参照値の自動変化に適用されるもの

1/28 ・光源の強度または距離の変化によるもの（G01J1/34 が優先）

1/30 ・電気的な放射線検出器によるもの

1/32 ・測定値または参照値の自動変化に適用されるもの

1/34 ・交互にまたは連続的に使用された分離光路によるもの，例．フリッカ

1/36 ・電気的な放射線検出器によるもの

1/38 ・全体的視覚手段によるもの（G01J1/10 が優先）

1/40 ・可視限界または吸光効果によるもの

1/42 ・電気的な放射線検出器によるもの（参照光または電気値との比較によるもの G01J1/10；光学および機械部分 G01J1/04）

A 紫外線に係るもの

B 赤外線に係るもの〔物体検知，リモセン映像含む〕

C 火災・燃焼状態に係るもの

D レザ・光パワに係るもの

E 光ビームに係るもの〔ビーム径含む〕

F 光ファイバを用いるもの

G ストリク管等を用いるもの〔光電子増倍管含む〕

H アバランシェ・ダイオードを用いるもの

J 照度測定に係るもの〔日射測定を含む〕

K 輝度測定に係るもの

L 光度測定に係るもの

M 閃光測定に係るもの

N 投光・受光測定に係るもの

1/44	P 光学読取等に係るもの Q 分析に係るもの R 液晶に係るもの Z その他のもの〔地震含む〕 ..電気回路 A 測光回路 B 表示回路 C 最小・最大値検出回路 D 温度補償回路 E 感度補償・利得制御回路 F 光電変換回路〔演算増幅器、対数圧縮等〕 G カメラ用測光回路 H 露出制御回路〔G03B7/00 参照〕 J 接合容量の影響除去回路 K 情報設定回路 L デジタル回路 M 周波数成分検出回路〔チラツキ、等含む〕 N 多素子測光回路 P 半導体回路〔イメ - ジセンサ・CCD・波長分離含む〕 Z その他のもの	3/30 3/32 3/36 3/40 3/42 3/427 3/433 3/44 3/443 3/447 3/45 3/453 3/457 3/46	..スペクトル上で直接スペクトル線強度を測定するもの（G01J3/42,G01J3/44 が優先） ...単一検出器によるスペクトルバンドの順次調査 ...別々の検出器によるスペクトル中の2以上のバンドの調査 ..スペクトルの写真濃度の測定によるスペクトル線強度の測定；分光写真（G01J3/42,G01J3/44 が優先）[4] ..吸収分光測定；二光束分光測定；フリッカ - 分光測定；反射分光測定（光線切換装置の構成 G01J3/08）[4] U 赤外線吸収分光測定 Z その他のもの ...二波長分光測定 [4] ...変調分光測定；微分分光測定 [4] ..ラマン分光測定；散乱分光測定 [4] ..発光分光測定 [4] ..偏光分光測定 [4] ..干渉分光測定 [4] ...振幅の相互干渉によるもの [4] ..相関分光測定、例・スペクトル強度の相関（G01J3/453 が優先）[4] ・色の測定；色測定装置、例・比色計（色温度の測定 G01J5/60）[4]
1/46	...コンデンサ - によるもの		
1/48	・化学的效果によるもの		A 比色計
1/50	..指示器の色が変化するもの、例・化学光量計		Z 色測定装置、方法一般
1/52	..写真効果によるもの	3/50	..電気的な放射線検出器によるもの [4]
1/54	..ガスの光反応を観察することによるもの	3/51	...色フィルタ - を用いるもの [4]
1/56	・放射圧またはラジオメ - タ - の効果によるもの	3/52	..色標によるもの
1/58	・光により発生したルミネッセンスによるもの	4/00	偏光の測定 [2]
1/60	・目のひとみを測定することによるもの	4/02	・視野分離形偏光計；半影形偏光計 [2]
3/00	分光測定；分光光度測定；モノクロメータ；色の測定 [4]	4/04	・電気的検出手段を利用する偏光計（G01J4/02 が優先）[2]
3/02	・細部 C 較正・補正 R 表示・記録装置の構成 S センサ - の構成 Z その他のもの		A 偏光子、補償子および検光子の組合せ、PCSA 方式 D 直線偏光の方位角を測定するもの、方位偏光計、旋光計 Z その他のもの
3/04	..スリットの構成	5/00	放射温度計、例・赤外または光学温度測定 [2022.01]
3/06	..走査装置の構成		B 放射率測定に係るもの
3/08	..光線切換装置の構成	5/00 101	Z その他のもの
3/10	..特に分光測定または比色測定に適用される光源の構成		・測温対象が特殊なもの B シ - ト状物体の測温 C 半導体基板の測温 D 熔融物体の測温 E 線状、筒状体の測温 A その他の炉内、金属表面の測温 F 電子レンジ内の測温 G 耳式、体腔内式体温計の受光部 H 複写機、プリンタ内の測温、例・定着部 Z その他のもの
3/12	・スペクトルの発生；モノクロメータ		・構造の細部 [2022.01]
3/14	..屈折素子、例・プリズム、によるもの（G01J3/18,G01J3/26 が優先）	5/02	J 検出器の構造 Z その他のもの
3/16	...自動視準装置をもつもの	5/03	..放射温度計に特に適した指示または記録の構成 [2022.01]
3/18	..回折素子、例・回折格子、によるもの	5/04	..ケ - ス [2006.01]
3/20	...ロ - ランド円分光計	5/05	..光学系構成要素の汚染防止手段；または放射路閉塞を防止する手段 [2022.01]
3/22	...リトロミラ - 分光計		
3/24	...特定次数のために設計された回折格子によるもの		
3/26	..多重反射によるもの、例・ファブリ - ペロ - 干渉計、可変干渉フィルタ -		
3/28	・スペクトルの調査（色フィルタ - を用いるもの G01J3/51）[4]		

5/06	・・妨害放射線の影響を除去するための構成；感度の変化を補償するための構成（集光される放射線の立体角を調整するためのもの G01J5/07；波長を選択するための手段 G01J5/0801） [2022.01]	5/28	・・光電管 または光起電力素子を用いるもの [2006.01]
5/061	・・装置または装置の一部の温度の制御によるもの、例、冷却手段またはサ - モスタットを用いるもの [2022.01]	A	光電管を用いるもの
5/068	・・温度以外のパラメ - タの制御によるもの [2022.01]	C	フォトダイオ - ド、フォトトランジスタ、太陽電池を用いるもの
5/07	・・集光される放射線の立体角を調整するための装置、例、視野を調整または方向づけるもの、位置を追跡するものまたは角度位置を符号化するもの（光学コリメ - タ - 要素 G01J5/0806） [2022.01]	Z	その他のもの
5/08	・・光学的特徴 [2022.01]	5/30	・・その電気的特徴 [2006.01]
B	光学的走査手段	5/34	・・コンデンサ - によるもの、例、焦電素子 [2022.01]
Z	その他のもの	A	焦電型検出器によるもの
5/0801	・・波長を選択または弁別するための手段 [2022.01]	E	・アレイ型
5/0802	・・光学フィルタ [2022.01]	C	電気容量変化型
5/0803	・・放射線信号を経時的に遮光するための装置 [2022.01]	Z	その他のもの
5/0804	・・シャッタ - [2022.01]	5/35	・・その電気的特徴 [2022.01]
5/0805	・・放射線をチョッピングする手段 [2022.01]	5/36	・・ガスの電離によるもの [2006.01]
A	光学系・構造的なもの	5/38	・固体または流体の伸長または膨張によるもの [2006.01]
B	電気回路に係るもの	5/40	・・バイメタル素子によるもの [2006.01]
Z	その他のもの	5/42	・・ゴレイセルによるもの [2006.01]
5/0806	・・焦点を合わせるまたは平行光にするもの、例、レンズまたは凹面鏡 [2022.01]	5/44	・・共振周波数の変化によるもの、例、圧電結晶の [2006.01]
5/0808	・・凸面鏡 [2022.01]	5/46	・放射圧またはラジオメ - タの効果によるもの [2006.01]
5/0813	・・平面鏡；平行位相板 [2022.01]	5/48	・サ - モグラフィ - ；全体的視覚手段によるもの [2022.01]
5/0818	・・導波路 [2022.01]	A	サ - モグラフィに係るもの
5/0821	・・光ファイバ [2022.01]	C	指定部分の温度表示・比較手段を用いるもの
5/0831	・・マスク；開口板；空間光変調素子 [2022.01]	D	イメ - ジセンサ等を用いるもの
5/0875	・・ウインドウ；それを固定するための装置 [2022.01]	E	補正手段を用いるもの
5/10	・電気的な放射線検出器によるもの [2006.01]	F	光学系・構造的なもの
C	温度分布測定 [5/48 優先]	G	非電氣的な検出器、例、液晶サ - モグラフィ
Z	その他のもの	Z	その他のもの
5/12	・・熱電素子によるもの、例、熱電対 [2006.01]	5/52	・参照値との比較によるもの、例、繊維消失型高温計 [2022.01]
A	熱電対、サ - モパイルによるもの	5/53	・・基準放射源、例、標準電球；黒体 [2022.01]
C	アレイ型	5/53 101	・・測温位置設置用黒体
Z	その他のもの	5/54	・・光学的特徴 [2006.01]
5/14	・・その電気的特徴 [2006.01]	5/56	・・その電気的特徴 [2006.01]
5/16	・・冷接点についての構成；周囲温度または他の変化の影響の補償 [2006.01]	5/58	・吸収によるもの；減光効果によるもの [2022.01]
5/20	・・放射線に感応する抵抗、サ - ミスタまたは半導体によるもの、例、光導電素子 [2006.01]	5/59	・偏光によるもの；その細部 [2022.01]
B	ボロメ - タによるもの	5/60	・色温度の測定によるもの [2006.01]
D	・接合を有するボロメ - タ	A	光学系・電気回路の結合に係るもの
F	・アレイ型	C	電気回路に係るもの
H	光導電素子（フォトコンダクタ）によるもの	D	光学系・構造的なもの
Z	その他のもの	E	2色温度計、多色温度計
5/22	・・その電気的特徴 [2006.01]	Z	その他のもの
5/24	・・特に適した回路の使用、例、ブリッジ回路 [2006.01]	5/70	・放射温度計測定値の受動的補償、例、周囲温度の感知によるものまたはケ - ス内部の温度の感知によるもの [2022.01]
		A	周囲温度による検出器の温度変動を補償するもの
		C	放射率を補償するもの
		E	測定光路中の吸収を補償するもの
		G	電気回路により補償するもの
		J	デ - タ処理（ソフトウェア）により補償するもの
		Z	その他のもの

5/80	・較正（参照値との比較によるもの G01 J5/52）[2022.01]
5/90	・放射温度計の試験，検査または動作確認 [2022.01]
7/00	光速度の測定
9/00	光学的位相差の測定；コヒ - レンス度の決定；光学的波長の測定（分光測定 G01 J3/00）[3]
9/02	・干渉法によるもの [3]
9/04	・同一光源ではあるが異った周波数の 2 つの波のうなりおよび得られた低周波の位相の測定によるもの [3]
11/00	個々の光パルスまたは光パルス列の特性の測定 [5]